ヘーズメーター

測定項目（各機種共通）
Haze：ヘーズ、Tt：全光線透過率、Td：拡散透過率、Tp：平行光線透過率

HZ-V3 ヘーズメーター

試験片に合わせて縦置き・横置き。

光学部計測部一体型のヘーズメーターで、試験片に合わせて縦置き・横置きが選択可能です。当社独自のTM 式ダブルビーム方式で長時間安定して測定が可能です。大きな試験片に対応したフラットな試料室で試験片サイズを選びません。試料室の扉を開くと測定光源が点灯するため、試験片の設置時に測定位置がひと目で確認できます(PAT.)。

測光方式	TM式ダブルビーム方式
測定光	C光及びD65光　（A光もご指定により可能 ＊）
試験片寸法	最大260×180×厚さ30mm ※試料台使用時　260×145×厚さ25mm
光源	ハロゲンランプ　12V　20W
受光器	シリコンフォトダイオードとフィルタの組合せ
安定性	⊿Ttの標準偏差　0.02以内（標準合わせ後、空気層で連続30回測定したとき）
電源容量	AC100～240V　約200VA　50/60Hz
本体寸法・質量	（縦置き時）　約幅32×奥行32×高さ48cm　質量約18Kg
付属品	データ転送ソフトウェア 校正標準板1枚（ヘーズ値 約1%・10%・20%から1枚選択、全光線透過率値付）
規格	ISO 13468-1、ISO 14782、ASTM D 1003、JIS K 7136、JIS K 7361-1、JIS K 7105（廃止）、JIS R 3212（A光）

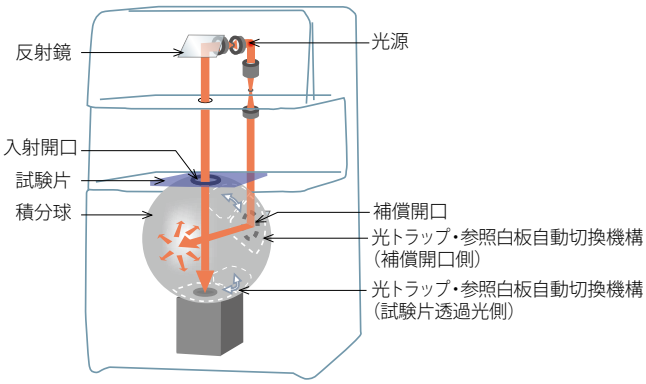
*A光をご指定の場合、C光またはD65光のいずれか1つを選択。

試料室に入らない大きな試験片も測定できます。

測定したい試験片に合わせて縦置き・横置きの設置方向を選ぶことができます。

ダブルビーム方式のしくみ

当社独自の TM 式ダブルビーム（2 光路）方式により、経時変化による光量減少をつねに補償しているため、長時間安定した測定が可能です。光源からの光が 2 つの光路に分けられ、平行度の高い平行光が、積分球の試験片透過光側（入射開口）と補償開口側から交互に自動入射し測定します。



モデル：HZ-V3

本カタログに記載の仕様は改善・改良のため予告なく変更することがあります。本体の付属品・オプション品については、仕様書をご確認ください。当社の製品は規格（JIS、ISO、ASTM 等）に基づいて製造しています。測定対象物の材質・形状・様々な光学特性により測定値が影響を受ける場合があります。ふさわしい測定方法については別途ご相談ください。

スガ試験機株式会社 総合カタログ

Ⅰ. 耐候性を極める。―――― 促進耐候性試験機

Ⅱ. 腐食性を極める。―――― 腐食促進試験機

Ⅲ. 色彩を極める。―― カラーメーター、光学測定器

Ⅳ. 過酷環境を極める。―― 産業分野別の試験機

スガ試験機は国際標準化に貢献しています。
ISO IEC CIE ASTM

100th Since 1920

スガ試験機株式会社
Suga Test Instruments Co., Ltd.
www.suga-global.com
www.sugatest.co.jp

本社・研究所 〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-4-14 tel 03-3354-5241 fax 03-3354-5275
日高・川越工場 〒350-1213 埼玉県日高市高萩 1973-1 tel 042-985-1661 fax 042-989-6626
名古屋支店 〒465-0051 名古屋市名東区社が丘 1-605 tel 052-701-8375 fax 052-701-8513
大阪支店 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町 3-23 tel 06-6386-2691 fax 06-6386-5156
広島支店 〒733-0033 広島市西区観音本町 2-12-11 tel 082-296-1501 fax 082-296-1503

2014年11月
(2024年2月改訂)